

Nazwa
kwalifikacji:

Eksplotacja urządzeń elektronicznych

Oznaczenie
kwalifikacji:

E.20

Numer zadania: **01**

Kod arkusza:

E.20-01-18.01_zatw_CKE

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Wykaz wyposażenia stanowiska pomiarowego <i>Uwaga: dopuszcza się stosowanie równoważnych sformułowań</i>
<i>Zadający w tabeli 5 w dowolnej kolejności zapisal:</i>	
R.1.1	zasilacz , funkcja zasilenie układu lub generator poziomów logicznych , funkcja zadanie stanów logicznych
R.1.2	analizator poziomów logicznych lub oscyloskop , funkcja pomiar poziomów logicznych
R.1.3	woltomierz lub multimetr lub oscyloskop , funkcja pomiar napięcia
R.1.4	multimetr lub tester diod , funkcja test diod
R.2	Rezultat 2: Ocena zgodności wyników pomiarów poziomów logicznych bramek B1 i B2 w bloku cyfrowym układu SWO ze stanami logicznymi sprawnego układu SWO
<i>Zadający w tabeli 6 zapisal:</i>	
R.2.1	wartości odczytane D1 dla bramki B1: H lub 1 (tryb nr 1), L lub 0 (tryb nr 2), H lub 1 (tryb nr 3), L lub 0 (tryb nr 4)
R.2.2	w każdym trybie dla bramki B1 wniosek: zgodny pod warunkiem, że poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym wierszu (trybie) są identyczne lub niezgodny, jeżeli poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym wierszu (trybie) są różne
R.2.3	wartości odczytane D3 dla bramki B2: H lub 1 (tryb nr 1), H lub 1 (tryb nr 2), H lub 1 (tryb nr 3), H lub 1 (tryb nr 4)
R.2.4	w każdym trybie dla bramki B2 wniosek: zgodny pod warunkiem, że poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym wierszu (trybie) są identyczne lub niezgodny, jeżeli poziomy logiczne w kolumnie 4 i 5 w danym wierszu (trybie) są różne
R.3	Rezultat 3: Ocena zgodności wyników pomiarów napięć w bloku analogowym układu SWO z wynikami przewidywanymi dla układu działającego poprawnie
<i>Zadający w tabeli 7 zapisal wniosek dla:</i>	
R.3.1	baza tranzystora T1: niezgodny
R.3.2	kolektor tranzystora T1: niezgodny
R.3.3	baza tranzystora T2: zgodny
R.3.4	kolektor tranzystora T2: zgodny
R.3.5	baza tranzystora T3: zgodny
R.3.6	kolektor tranzystora T3: zgodny
R.4	Rezultat 4: Ocena zgodności wyników pomiarów napięć na złączach p-n diod D1÷D3 oraz tranzystorów T1÷T3 z wynikami przewidywanymi dla układu działającego poprawnie
<i>Zadający w tabeli 8 zapisal wniosek dla złącza:</i>	
R.4.1	anoda-katoda diody D1: zgodny
R.4.2	anoda-katoda diody D2: zgodny
R.4.3	anoda-katoda diody D3: zgodny
R.4.4	baza-emiter tranzystora T1: niezgodny
R.4.5	baza-kolektor tranzystora T1: niezgodny
R.4.6	baza-emiter tranzystora T2: zgodny
R.4.7	baza-kolektor tranzystora T2: zgodny
R.4.8	baza-emiter tranzystora T3: zgodny
R.4.9	baza-kolektor tranzystora T3: zgodny
R.5	Rezultat 5: Ocena sprawności wybranych elementów wchodzących w skład układu SWO
<i>Zadający w tabeli 9 zapisal wniosek dla elementu:</i>	
R.5.1	CD4081BP Bramka B1: sprawna
R.5.2	CD4081BP Bramka B2: niesprawna
R.5.3	BC547C Tranzystor T1: niesprawny
R.5.4	BC547C Tranzystor T2: sprawny
R.5.5	BC547C Tranzystor T3: sprawny
R.5.6	1N4148 Dioda D1: sprawna
R.5.7	1N4148 Dioda D2: sprawna
R.5.8	1N4148 Dioda D3: sprawna
R.6	Rezultat 6: Wybór elementów przeznaczonych do wymiany w celu naprawy usterki układu SWO
<i>Zadający w tabeli 10 w zapisal:</i>	
R.6.1	funkcję elementu: Bramka B2 lub B2
R.6.2	typ elementu przeznaczonego do wymiany: CD4081BP lub CD4081 pod warunkiem, że dotyczy bramki B2
R.6.3	typ elementu zastępczego: CD4081BP lub CD4081 pod warunkiem, że dotyczy bramki B2
R.6.4	funkcję elementu: Tranzystor T1 lub T1
R.6.5	typ elementu przeznaczonego do wymiany: BC547C lub BC547 pod warunkiem, że dotyczy tranzystora T1
R.6.6	typ elementu zastępczego: BC547C lub BC547 pod warunkiem, że dotyczy tranzystora T1